

镀 CsI 光阴极厚 GEM 的模拟和测试

Thursday, 16 August 2012 11:05 (10 minutes)

利用 MaxWELL 和 Garfield 进行了厚 GEM 的 2D 和镀 CsI 厚 GEM 的 3 D 模拟, 研究了电场分布和光入孔效率与厚 GEM 孔径、孔间距、厚度, 以及绝缘环 rim 大小的关系, 进而对厚 GEM 的几何结构进行了优化。基于优化后的参数制作了双层厚 GEM 并进行了 CsI 光阴极镀膜。测试结果表明紫外光入孔效率与模拟比较符合。

关键词: 厚 GEM, CsI 光阴极, MaxWELL, Garfield, 入孔效率, 紫外

Primary author: Mr 谢, 宇广 (epc)

Presenter: Mr 谢, 宇广 (epc)

Session Classification: 第一分会场 (探测器)

Track Classification: 核探测器